

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA PER L'ACQUISIZIONE DI N° 1 MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE AD EMISSIONE DI CAMPO (FESEM) CORREDATO DI RILEVATORI PER MICROANALISI E DISPERSIONE DI ENERGIA (EDS) E DIFFRAZIONE DI ELETTRONI RETRODIFFUSI (EBSD). CIG: B1BA0654BE.

SCHEDA PROPOSTA TECNICA

Il sottoscritto nato il a in qualità di
..... dell'impresa con sede in
..... con codice fiscale n... con partita IVA n
.....

che partecipa alla sopracitata gara quale _____

- a) **SI IMPEGNA** a fornire i beni con le caratteristiche di cui al Capitolato Tecnico Allegato A, annesso 1, proposta tecnico-organizzativa;
- b) **SI IMPEGNA** a fornire le prestazioni relative alle caratteristiche tecniche “premiali” indicate nella sottostante Tabella, così come riportate in Allegato A, Annesso 2 “*Fattore Tecnico*”;

Si richiede all'Operatore Economico proponente di riportare nelle tabelle che seguono, le prestazioni premiali offerte secondo i criteri riportati nell'allegato A “*Criteri di Valutazione tecnico economica*”.

Data _____

IL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I

ATTENZIONE:

1. Si specifica che alle prestazioni base, offerte a pena di esclusione, non verrà riconosciuto alcun punteggio premiale;
2. Solo con riferimento alle prestazioni premiali misurabili, qualora non venisse indicato alcun valore, non verrà riconosciuto punteggio premiale;
3. Solo con riferimento alle prestazioni premiali non misurabili, ogni campo riservato all'operatore economico deve risultare compilato a pena di esclusione;
4. Le formule di calcolo sono esplicitate in Allegato A, Annesso 4 "Formule Assegnazione Punteggi".

Esempio 1								
1.	Caratteristiche colonna elettronica	Unità di misura	Prestazione base (P _{base})	Prestazione migliore (P _{best})	Coefficiente (C)	Peso (W)	Punteggio (TS)	Colonna riservata all'operatore economico Indicare la prestazione offerta P _{eff} (valore numerico)
1.1	Risoluzione (R) @15kV	nm	0,9	Miglior offerta (minima)	$\frac{P_{base} - P_{eff}}{P_{base} - P_{best}}$	3	$C \cdot W$	0,8

Esempio 1 per la caratteristica della colonna elettronica relativa alla risoluzione a 15kV:

5 Ditte (A, B, C, D, E) presentano offerta: A offre 1,0; B offre 0,9; C offre 0,8; D offre 0,5; E non compila il campo

La prestazione migliore quindi P_{best}=0,5 da cui:

- La Ditta A sarà esclusa dalla gara;
- La Ditta B otterrà 0 (zero) punti;
- La Ditta C otterrà 0,75 punti;
- La Ditta D otterrà 3,00 punti;
- La Ditta E otterrà 0 (zero) punti.

Esempio 2				
4.	Caratteristiche colonna elettronica	prestazioni	Punteggio (TS)	Colonna riservata all'operatore economico spuntare la prestazione offerta
4.1	Sistema di decelerazione degli elettroni	caratteristica non offerta	0	<input type="checkbox"/>
		Con applicazione di bias elettrico a stage/campione	1	<input type="checkbox"/>
		Sistema integrato in colonna	2	<input type="checkbox"/>
		Sistema integrato in colonna e bias elettrico	3	<input type="checkbox"/>

Esempio2: per la caratteristica della colonna elettronica relativa al sistema di decelerazione degli elettroni:

5 Ditte (A, B, C, D, E) presentano offerta: A spunta "caratteristica non offerta"; B spunta "Con applicazione di bias elettrico a stage/campione"; C spunta "Sistema integrato in colonna", D spunta "Sistema integrato in colonna e bias elettrico"; E non spunta alcuna casella

- La Ditta A, otterrà 0 (zero) punti;
- La Ditta B otterrà 1 punto;
- La Ditta C otterrà 2 punti;
- La Ditta D otterrà 3 punti;
- La ditta E sarà esclusa dalla gara.

CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI MISURABILI

1.	Caratteristiche colonna elettronica	Unità di misura	Prestazione base (P _{base})	Prestazione migliore (P _{best})	Coefficiente (C)	Peso (W)	Punteggio (TS)	Colonna riservata all'operatore economico Indicare la prestazione offerta P _{eff} (valore numerico)
1.1	Risoluzione (R) @15kV	nm	0,9	Miglior offerta (minima)	$\frac{P_{base} - P_{eff}}{P_{base} - P_{best}}$	3	C · W	
1.2	Risoluzione (R) @1kV senza bias al campione	nm	1,2	Miglior offerta (minima)	$\frac{P_{base} - P_{eff}}{P_{base} - P_{best}}$	3	C · W	
1.3	Risoluzione (R) @ 15kV e 5-7 nA alla WD analitica	nm	3.0	Miglior offerta (minima)	$\frac{P_{base} - P_{eff}}{P_{base} - P_{best}}$	3	C · W	
1.4	Campo visivo alla WD analitica	mm	3	Miglior offerta (massima)	$\frac{P_{eff} - P_{base}}{P_{best} - P_{base}}$	3	C · W	
2.	Tavolino portacampione	Unità di misura	Prestazione base (P _{base})	Prestazione migliore (P _{best})	Coefficiente (C)	Peso (W)	Punteggio (TS)	
2.1	Escursione su asse X	mm	110	Miglior offerta (massima)	$\frac{P_{eff} - P_{base}}{P_{best} - P_{base}}$	1	C · W	
2.2	Escursione su asse Y	mm	80	Miglior offerta (massima)	$\frac{P_{eff} - P_{base}}{P_{best} - P_{base}}$	1	C · W	
2.3	Escursione su asse Z	mm	40	Miglior offerta (massima)	$\frac{P_{eff} - P_{base}}{P_{best} - P_{base}}$	3	C · W	
3.	Camera di lavoro	Unità di misura	Prestazione base (P _{base})	Prestazione migliore (P _{best})	Coefficiente (C)	Peso (W)	Punteggio (TS)	
3.1	Diametro	mm	120	Miglior offerta (massima)	$\frac{P_{eff} - P_{base}}{P_{best} - P_{base}}$	2	C · W	
3.2	Altezza	mm	45	Miglior offerta (massima)	$\frac{P_{eff} - P_{base}}{P_{best} - P_{base}}$	3	C · W	

CARATTERISTICHE TECNICHE PREMIALI NON MISURABILI

4.	Caratteristiche colonna elettronica	prestazioni	Punteggio (TS)	Colonna riservata all'operatore economico spuntare la prestazione offerta
4.1	Sistema di decelerazione degli elettroni	caratteristica non offerta	0	<input type="checkbox"/>
		Con applicazione di bias elettrico a stage/campione	1	<input type="checkbox"/>
		Sistema integrato in colonna	2	<input type="checkbox"/>
		Sistema integrato in colonna e bias elettrico	3	<input type="checkbox"/>

5.	Caratteristiche del rivelatore per microanalisi (EDS)	prestazioni	Punteggio (TS)	Colonna riservata all'operatore economico spuntare se prestazione offerta
5.1	Large Area Mapping	<p>Possibilità di analisi su grandi aree (Large Area Mapping), automatizzando senza intervento dell'operatore i movimenti dello stage del SEM per realizzare mappe di grandi dimensioni o differenti mappe su zone distinte del campione, programmabili.</p> <p>Il software deve poter incollare in maniera automatica le varie immagini al fine di ricostruire una mappa in un unico file.</p> <p>Deve essere integrabile con il Particle Analysis richiesto nei requisiti minimi, al fine di poter effettuare una analisi di particelle in maniera automatica su porzioni di campione più grandi del singolo frame</p>	20	<p>Prestazione non offerta <input type="checkbox"/></p> <p>Prestazione offerta <input type="checkbox"/></p>

6.	Caratteristiche del rivelatore per diffrazione di elettroni retrodiffusi (EBSD)	prestazione	Punteggio (TS)	Colonna riservata all'operatore economico spuntare se prestazione offerta
6.1	Software per l'identificazione dei pattern tramite simulazione	<p>Software per l'identificazione dei pattern tramite simulazione (e.g. dynamic simulation/template matching/pattern matching).</p> <p>Il software deve consentire la simulazione e quindi il riconoscimento dei pattern di diffrazione tramite la teoria dinamica della diffrazione elettronica, utilizzando sia posizione che intensità delle bande di Kikuchi.</p>	25	<p>Prestazione non offerta <input type="checkbox"/></p> <p>Prestazione offerta <input type="checkbox"/></p>